

参考資料

Application Report SBAA141

産業電力計測用データ・コンバータ

概要

現代の産業用アプリケーションはノイズ発生源で満ちあ ふれています。望ましくないノイズは、このような環境で の電力計測や回路保護に関する主要な問題のひとつをもた らしています。したがって、ノイズ源の特性を知り、その 動作を理解することは、電子回路の設計者およびユーザに とって有益です。本アプリケーション・レポートは、次の2 つの主題について議論します。まず、本レポートの前半は電 子ノイズの基本的な概念について定義し、後半ではアナロ グ・トゥ・デジタル・コンバータ(ADC)とともに使用される フィルタの選定と設計について述べます。また、ADS8364と 専用トランスを用いた電圧および電流計測の設計例を、数式 と実験結果とともに提供します。

内容

ノイズの種類	2
差動信号用のノイズ・フィルタ設計	3
シングルエンド信号用のノイズ・フィルタ設計	4
計測結果	5
結 論	9

解説図

図1.	代表的なノイズ源	2
図2.	ADS8364の代表的な電力計測アプリケーション回路(差動信号)	3
図3.	等価差動および同相フィルタの周波数応答	4
図4.	ADS8364の代表的な電力計測アプリケーション回路(シングルエンド信号)	4
図5.	表1によるフィルタ・コンデンサC1の関数としてのAC特性曲線	6
図6.	表1によるフィルタ·コンデンサC1の関数としてのTHDおよび高調波歪み	6
図7.	ADS8364の4096ポイントのFFT結果(図2の差動入力フィルタ回路を最適化)	7
図8.	表2によるフィルタ・コンデンサC1の関数としてのAC特性曲線	8
図9.	表2によるフィルタ・コンデンサC1の関数としてのTHDおよび高調波歪み	8
図10). ADS8364の4096ポイントのFFT結果	9

ノイズの種類

電子回路におけるノイズは、電磁干渉(EMI)、高周波干 渉(RFI)、およびグランド・ループによって引き起こされる ことが最も多いです。交流電力の観点からすると、同相ノ イズはニュートラルとグランド導体間のノイズ信号になり ます。この種の信号干渉は、ライン(ホットとも言う)と ニュートラル導体間に見られるノーマルモード・ノイズ(以 下、差動ノイズ)とは異なります。

同相ノイズのインパルスは、それに関連する差動ノイズ 信号よりも高周波の傾向があります。同相ノイズ信号の大 半が差動ノイズ信号間の容量結合により発生することから、 この傾向の特性は予想されます。動作周波数が増加するに つれ、ライン、導体、ニュートラルおよびグランド間の結 合は増加します。電子装置は同相ノイズに対して差動ノイ ズよりも10から100倍も敏感です。

パワー・ライン(以下、電源ライン)に存在するノイズは、 あらゆる時点で驚くべき量になります。このノイズの発生 源は、建物の内部および外部における電気分配システムに より生じます。このノイズ自体は、電源ラインで常に変化 する負荷により生ずる、電源ラインの動的な性質の結果で す。図1に電源ラインに見られる代表的なノイズを示します。 簡便なパワー・トランスや絶縁トランスでは、差動ノイズ

のインパルスを阻止できません。しかし、これらのトラン スの2次側でニュートラルをグランドに接続すると、差動 ノイズが同相ノイズに変換されます。マイクロエレクトロ ニクス回路(微小電子回路)の観点からすると、同相ノイズ は場合によっては差動ノイズより有害です。

電力計測のようなデータ·アクィジション(データ収集) システムでは、差動入力型ADCの利点を採用してノイズの 影響を低減できます。すなわち、インピーダンスを平衡さ せることで、差動入力型ADCにより除去できる同相信号に ノイズ源を変換できます。

差動信号は大部分の産業用アプリケーションにより適して います。差動信号を測定すると、同相ノイズは完全に除去さ れないまでも劇的に低減します。産業用や高ノイズのアプリ ケーション向けに、テキサス・インスツルメンツから数個の バー・ブラウン製品が、完全差動信号パスの使用による最大 限の利点を設計者に提供するために製造されています。



図1.代表的なノイズ源



図 2. ADS8364の代表的な電力計測アプリケーション回路(差動信号)

差動信号用のノイズ・フィルタ設計

高ノイズの環境におけるアプリケーション用に特に設計 されたADCのひとつが、ADS8364です。その入力信号範囲 は2.5V±2.5Vです。例えば産業用電力計測の場合、電圧測 定トランスの出力は一般に±10Vです。したがって、計測ト ランス出力をADCに印加する前に、出力信号を分圧すると ともに、コンバータの差動入力範囲に適合するようにオフ セットする必要があります。

図2の抵抗R_{2A}およびR_{2B}は、トランスT_{r1}からの出力信号 をADCの基準電圧 (V_{REF})付近にオフセットします。R_{1A}お よびR_{2A}の抵抗網はR_{1B}およびR_{2B}とともに、差動入力信号 をADCのフルスケール範囲 (FSR)に分圧します。その分圧 率すなわちこの抵抗網のゲインを式 (1)に示します。この 回路を適正に作動させるには、抵抗R_{1A}およびR_{1B}は値が等 しくなければならず、抵抗R_{2A}およびR_{2B}も同様に等しい値 でなければなりません。このとき、差動および同相信号の 減衰は等しくなります。

$$G_{DIFF} = G_{CM} = \frac{R_{2A}}{R_{1A} + R_{2A}} = \frac{R_{2B}}{R_{1B} + R_{2B}}$$
 (1)

抵抗R_{1A}およびR_{1B}は、信号源の重い負荷にならないよう に十分な高インピーダンスである必要があります。また、 それらは入力過負荷保護にもなり、ADC入力を外部の過大 な信号源から分離します。 この次の段階は、ローパスフィルタを実装し、ADCに印 加する差動信号からノイズをフィルタリングすることです。 ADCの(+)および(-)入力間にコンデンサC₁を付加すると、 差動フィルタが生成されます。

最終的に、発生した同相信号は抵抗分圧回路で減衰し、 次に実装したRCフィルタでさらに減衰することになりま す。同相信号の遮断周波数は式(2)で計算できます。

$$BW_{CM} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \frac{R_{1A} \cdot R_{2A}}{R_{1A} + R_{2A}} \cdot C_{2A}}$$
$$= \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \frac{R_{1B} \cdot R_{2B}}{R_{1B} + R_{2B}} \cdot C_{2B}}$$
(2)

このフィルタの-3dB差動帯域幅は式(3)で表されます。

$$BW_{DIFF} = \frac{1}{2 \bullet \pi \bullet \frac{2 \cdot R_{1A} \cdot R_{2A}}{R_{1A} + R_{2A}} \bullet \left(C_1 + \frac{C_{2A}}{2}\right)}$$
(3)

同相信号用のフィルタ時定数間に少しでも不整合がある と、入力ブリッジが不平衡になり、高周波同相信号の除去 が低減します。しかし、ブリッジ出力間に接続されたコン デンサC₁が、ブリッジ部品の不整合によるAC同相信号除去 の誤差を効果的に低減します。



図3.等価差動および同相フィルタの周波数応答

例えば C_1 の値を C_{2A} あるいは C_{2B} の10倍以上にすると、 C_{2A} と C_{2B} の不整合により生じる同相信号除去誤差を20倍低 減します。図3は、差動フィルタおよび整合していない同相 フィルタの周波数応答を示します。上記の例では、1番目 の同相フィルタの遮断周波数にて差動フィルタは-26dB減 衰しています。したがって、2つの同相フィルタ間の-3dB 帯域幅における差異は、-26dB減衰されることになります。

シングルエンド信号用のノイズ・ フィルタ設計

同相ノイズが問題にならない場合は、差動信号はシング ルエンド信号に置き換えられます。シングルエンド構成で は、トランスの一方の側をグランドに接続します。その他 方の側は信号源として働きます。先の例と同様にトランス の出力信号は±10Vであり、それを分圧してADS8364の差動 入力と整合させる必要があります。図4の抵抗網は入力信号 を分圧およびオフセットし、フルスケール範囲 (FSR)を0V から5Vにします。

 R_1, R_2, R_3 および R_4 の抵抗網は、シングルエンド入力信 号をADCのFSRに分圧します。この抵抗網の分圧率(すなわ ちゲイン)は、先の例と等しい必要があります。したがって、 この回路を適切に作動させるには、 R_1, R_2 および R_4 が等し く、かつそれぞれの値が抵抗 R_3 の2倍でなければなりません。

次の段階は、ADCに印加されるシングルエンド信号から ノイズをフィルタリングするため、ローパス・フィルタを実 装することです。コンデンサC₁をADCの(+)入力とグランド に挿入すると、そのローパス・フィルタが形成されます。



図 4. ADS8364の代表的な電力計測アプリケーション回路(シングルエンド信号)

計測結果

ADS8364を3.8MHzのクロックで動作させて計測を行いま した。サンプリング・レートは38kHzです。これらの条件に より、変換時間は4.47 μ sおよびアクィジション・タイムは 21.84 μ sになりました。また、差動信号に関しては、抵抗の 値を R_{1A} と R_{1B} は4 $k\Omega$,および R_{2A} と R_{2B} は1.3 $k\Omega$ に選択しまし た。これらの抵抗値によるゲインは0.245になります。した がって、±10Vのトランス出力電圧は、フルスケールで ADC入力の4.9Vになります。コンデンサ C_1 の値は0から 3.3nFまで変えました。

シングルエンド信号に使用するADCにも同じ動作条件を 適用して、それぞれの抵抗値を R_1 , R_2 および R_4 は6.48 $k\Omega$ 、 R_3 は3.24kΩにしました。これらの抵抗値によるゲインは 0.250になります。したがって、±10Vのトランス出力電圧 は、フルスケールでADC入力の5Vになります。コンデンサ C_1 の値は0から1.8nFまで変えました。

ここで、次のことを理解することが極めて重要です。す なわち、等価抵抗RとC1による入力フィルタの時定数が、 ADCのサンプリング時間の1/5を超えてはなりません。それ 以上の時定数では、特性の低下が予想されます。

以上の計測を実施し、その結果を解析しました。表1に差 動信号の計測結果を示します。また、図5と図6に表1の計測 データをグラフ表示します。

Capacitor (nF)			AC Performance				Harmonics			
С ₁	C _{2A}	C _{2B}	SNR	SINAD	SFDR	THD	3rd	5th	7th	9th
0.00	0.00	0.00	84.8	83.7	90.6	-90.0	-90.6	-102.3	-102.4	-114.1
0.56	0.00	0.00	85.3	84.8	98.2	-94.3	-98.2	-98.5	-101.0	-122.0
1.00	0.00	0.00	85.3	84.9	98.1	-94.8	-98.1	-99.8	-101.6	-122.8
1.20	0.00	0.00	85.5	85.0	98.4	-94.7	-98.7	-99.2	-101.1	-115.5
1.50	0.00	0.00	85.3	84.9	98.2	-95.4	-99.6	-99.7	-101.8	-124.3
1.80	0.00	0.00	85.3	85.0	98.1	-96.3	-101.4	-100.4	-102.4	-110.1
2.20	0.00	0.00	85.3	84.9	97.9	-95.6	-103.1	-100.1	-100.5	-105.1
3.30	0.00	0.00	84.2	81.8	88.4	-85.6	-88.4	-92.3	-93.8	-96.7
1.80	0.18	0.18	86.0	85.6	100.4	-96.2	-101.6	-100.4	-101.6	-113.8

表1.図2の差動信号の計測実験データ



図 5. 表1によるフィルタ・コンデンサの関数としてのAC特性曲線



図 6. 表1によるフィルタ・コンデンサの関数としてのTHDおよび高調波歪み

上記の計測を先行した後、コンデンサ C_{2A} および C_{2B} を付 した。そこで、 C_1 を1.8nF, C_{2A} および C_{2B} を0.18nFに選択す けました。計測した最小THDは、 C_1 の値が大体2nFのときで ると、1.9nFの等価コンデンサが得られます。



図7. ADS8364の4096ポイントのFFT結果(図2の差動入力フィルタ回路を最適化)

同相信号フィルタ用のコンデンサ C_{2A} および C_{2B} を付加すると、SNRが改善されます。それを付加した最終回路のFFT結果を図7に示します。

同様の計測を図4の回路を使用して実施します。その結果 をシングルエンド信号について表2に示します。また、表2 の計測データを図8および図9にグラフ表示します。

Capacitor (nF) AC Performance					Harmonics					
C ₁	SNR	SINAD	SFDR	THD	2nd	3rd	5th	7th		
0.00	83.37	82.26	92.55	-88.74	-92.55	-108.11	-92.91	-97.49		
0.15	85.67	84.67	95.93	-91.57	-95.93	-100.81	-96.42	-100.82		
0.33	85.96	84.86	95.65	-91.35	-95.65	-100.10	-96.36	-100.65		
0.51	85.77	84.66	95.57	-91.12	-95.57	-99.42	-96.50	-100.27		
0.68	86.09	85.00	95.64	-91.51	-95.64	-100.33	-96.83	-100.60		
0.82	86.36	85.27	95.78	-91.83	-95.78	-102.92	-97.05	-99.91		
1.00	86.35	85.05	95.00	-90.92	-95.00	-98.98	-96.65	-99.95		
1.20	85.69	82.97	90.56	-86.30	-92.31	-90.56	-93.09	-96.16		
1.50	83.50	77.94	81.92	-79.35	-88.49	-81.92	-86.76	-89.76		
1.80	81.04	74.34	77.72	-75.39	-85.42	-77.72	-83.00	-85.76		

表2.図4のシングルエンド信号の計測実験データ



図8.表2によるフィルタ·コンデンサの関数としてのAC特性曲線



図9.表2によるフィルタ·コンデンサの関数としてのTHDおよび高調波歪み

TEXAS INSTRUMENTS

シングルエンド回路のFFT結果を図10に示します。



図 10. ADS8364の4096ポイントのFFT結果(図 4のシングルエンド入力フィルタ回路を最適化)

結論

上述の解析では、産業用途の電力計測に高性能なADCを 実現する、単純かつ効果的な方法を示しました。ノイズ源 および計測回路における遅延に関する理解は、最終設計の 決定に不可欠です。適切なフィルタリングは有害な差動お よび同相ノイズを低減するだけでなく、ADCの最高性能に おける動作も可能にします。入力信号を適切に分圧および オフセットする(同時にADC入力も保護する)入力抵抗分圧 回路を選定した後、異なるコンデンサで数回の測定が必要 です。これらのコンデンサはADC入力の帯域幅を低減し、 SNR特性および有効ビット数を向上させます。また、これ らのコンデンサの値は、ADCのサンプリングタイムだけで なく入力抵抗の値にも正比例します。本アプリケーション・ レポートでは、比較的高い信号源インピーダンスで動作す るADCと適切に設計された差動フィルタにより、98dB以上 のSFDR,および85dB以上のSNRでの-96dB以下のTHDと いう計測が可能であることを示しています。



日本テキサス・インスツルメンツ株式会社(以下TIJといいます) 及びTexas Instruments Incorporated(TIJの親会社、以下 TIJおよびTexas Instruments Incorporatedを総称してTIとい います)は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、 その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提 供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注され る前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有 効かつ完全なものであるかどうかご確認下さい。全ての製品は、お 客様とTIとの間に取引契約が締結されている場合は、当該契約 条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご 注文の受諾の際に提示されるTIの標準契約約款に従って販売 されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定されうる危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合せ、 機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回 路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのラ イセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明 もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情 報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用するこ とについてライセンスを与えるとか、保証もしくは是認するということ を意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許そ の他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なけれ ばならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づ きTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製 することは、その情報に一切の変更を加えること無く、且つその情 報と結び付られた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製が なされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加 えて複製することは不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、 そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負 いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、 条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされ た説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該 TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らか の黙示的保証を無効にし、且つ不公正で誤認を生じさせる行為 です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

なお、日本テキサス・インスツルメンツ株式会社半導体集積回路 製品販売用標準契約約款もご覧下さい。 http://www.tij.co.jp/jsc/docs/stdterms.htm

Copyright©2005, Texas Instruments Incorporated 日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

